## ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

УДК 544.323.2:621.315.592.4

# ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА(II) С МАССИВОМ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ОКСИДА ЦИНКА

© 2020 г. В. В. Петров<sup>1\*</sup>, Ю. Н. Варзарев<sup>1</sup>, А. П. Старникова<sup>1</sup>, Х. А. Абдуллин<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Южный федеральный университет, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, Таганрог, Россия <sup>2</sup>Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа,

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

\**E-mail: vvp2005@inbox.ru* Поступила в редакцию 06.03.2019; после доработки 16.05.2019; принята в печать 22.05.2019

Проведено исследование газочувствительных свойств массива наноразмерных стержней оксида цинка, полученных методом гидротермального синтеза. Изучены их морфология и кристаллическая структура, электрофизические и газочувствительные свойства. На основе экспериментально определенных энергии активации проводимости и коэффициента газочувствительности проведен термодинамический анализ процесса взаимодействия оксида углерода (CO) с поверхностью наностержней оксида цинка. Показано, что изучаемый процесс включает взаимодействие между молекулой CO и заряженным адсорбционным центром поверхности оксида цинка.

*Ключевые слова:* оксид цинка, оксид углерода(II), наноразмерные стержни, энергия активации, газочувствительность, адсорбция, энергия Гиббса, энтальпия.

DOI: 10.31857/S0207401X20020089

## введение

Оксил шинка (ZnO) является широкозонным полупроводником n-типа проводимости и перспективным материалом для электронных, оптоэлектронных приборов и наногенераторов энергии [1-5]. В последнее время значительное внимание уделяется формированию и исследованию свойств наноразмерных структур ZnO (нанотрубки, наностержни, вискеры (whisker) и т.д.), которые используются в приборах функциональной электроники [6-8]. Серьезное внимание уделяется также исследованию уникальных газочувствительных свойств наноструктур ZnO по отношению к различным газам: к оксиду углерода(II) [8, 9], этанолу [10], водороду [11], аммиаку [12], оксиду азота [13]. Эти исследования обусловлены тем, что до конца не ясен механизм реакций, протекающих между молекулами анализируемого газа и поверхностью ZnO. В большинстве случаев указывается на участие в таких реакциях молекул или атомов кислорода, адсорбированных на поверхности и находящихся в ионизированном состоянии [4, 8–15]. В работе [16] с термодинамических позиций показано, что на поверхности ZnO наноструктур, в первую очередь, должны протекать реакции с участием молекул оксида углерода(II). В то же время известно, что на энергию взаимодействия молекулы газа с адсорбционным центром поверхности влияет полярность молекулы и величина заряда адсорбционного центра [17]. В связи с этим, целью работы являлось экспериментальное исследование процесса взаимодействия оксида углерода(II) с сенсорной структурой на основе наноразмерных стержней оксида цинка и анализ механизма этого взаимодействия с термодинамических позиций.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для оценки энергии взаимодействия молекул СО с поверхностью оксида цинка нами были исследованы газочувствительные свойства наностержней оксида цинка, которые были выращены по гидротермальной технологии в водном растворе нитрата цинка Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> · 6H<sub>2</sub>O и гексаметилентетрамина  $C_6H_{12}N_4$  в течение 1 ч при температуре 95°С на стеклянной подложке [18, 19]. Морфологию поверхности изучали с помощью сканируюшего растрового электронного микроскопа Quanta 3D 200і фирмы FEI (США), а рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре MiniFlex фирмы Rigaku Corp. (Япония) на длине волны  $Cu(K_{\alpha})$ -излучения (Национальная нанотехнологическая лаборатория, Казахский националь-



Рис. 1. Фотография РЭМ-изображения наноразмерных стержней ZnO (увеличение 100.000×, ускоряющее напряжение – 10 кВ) (*a*) и их рентгенограмма (*б*) в сравнении с рентгенограммой образца поликристаллического порошкового ZnO (JCPDS карта № 00-001-1136).

ный университет им. аль-Фараби), см. рис. 1. Для характеризации фазового состава наностержней использовали дифрактограмму поликристаллического ZnO (JCPDS карта № 00-001-1136) [20] (рис. 16) РФА показал, что преимущественным направлением роста оксида цинка при гидротермальном синтезе ZnO наностержней является направление (002).

Для исследования электрофизических и газочувствительных свойств поверх массива ZnO наностержней методом вакуумного термического напыления формировали V–Cu–Ni металлические контакты толщиной от 0.2 до 0.3 мкм. Измерения электрофизических и газочувствительных свойств в диапазоне рабочих температур 473–543 К проводили на автоматизированном стенде для калибровки газа центра коллективного пользования "Микросистемная техника и интегральная сенсорика" Южного федерального университета [21]. Вольтамперная характеристика (BAX) сформиро-



**Рис. 2.** Вольт-амперная характеристика сенсорной структуры на основе массива наноразмерных стержней ZnO, измеренная при 293 К (a) и ее температурная зависимость сопротивления ( $\delta$ ).

ванной структуры на основе массива наностержней ZnO, выращенных на стекле, представлена на рис. 2*a*. На рис. 2*б* показана температурная зависимость сопротивления структуры на основе ZnO наностержней, выращенных на стекле в интервале температур от 293 до 543 K, представленная в координатах (lnR - 1000/T).

Измерения газочувствительных свойств по отношению к оксиду углерода (II) проводили по схеме: подача СО заданной концентрации (от 20 до 100 ppm) в течение двух минут с расходом 0.3 л/мин — продувка воздухом также в течение двух минут с тем же расходом. Изменение сопротивления сенсора газа при воздействии СО с концентрацией 50 ppm при температуре 523 К представлено на рис. За, а на рис. Зб показана зависимость коэффициента газочувствительности исследуемой сенсорной структуры  $S = R_0/R_g$ , от концентрации молекул СО при 473, 523 и 543 К ( $R_g$  – сопротивление сенсорной структуры при воздействии газа,  $R_0$  – начальное сопротивление сенсорной структуры).

#### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования методом растровой электронной микроскопии показали, что сформированные ZnO наноразмерные стержни имеют, в основном, вертикальную ориентацию, однако значительное количество их соприкасаются друг с другом. Наностержни имеют длину 0.5-0.6 мкм и средний поперечный размер ~30-40 нм (рис. 1*a*). Вид ВАХ, близкий к линейному (рис. 2а), означает, что электрические контакты, образующиеся при соприкосновении наностержней оксида цинка друг с другом, и металлические контакты поверх ZnO наностержней являются омическими и не должны оказывать влияния на электрофизические и газочувствительные свойства сформированной сенсорной структуры. Это согласуется с результатами, представленными в работе [22].

Анализ температурной зависимости сопротивления сенсорной структуры (рис. 2 $\delta$ ) показывает, что при увеличении температуры сопротивление уменьшается, что характерно для полупроводниковых материалов. На графике температурной зависимости сопротивления можно выделить два линейных участка, соответствующих диапазонам температур: 303–313 К и 463–543 К. Расчет энергии активации электрической проводимости ( $E_a$ ) показал, что для первого участка  $E_a$  равна 0.315 эВ, а для второго – 0.65 эВ.

Из рис. За видно, что сопротивление сенсорной структуры при воздействии молекул СО уменьшается, а рассчитанный коэффициент газочувствительности S показывает наибольшие значения при температуре 543 К (рис. 36), что согласуется с литературными данными [8, 9]. Подобный характер отклика сенсорной структуры связан с вакансионной структурой кристаллического оксида цинка в целом и ZnO наноразмерных стержней в частности. Донорная проводимость оксида цинка в диапазоне температур 373-573 К определяется существующими в нем кислородными вакансиями [14-16], одновалентными межузельными атомами шинка и вакансиями двухвалентного цинка [23]. Однако донорные уровни, образованные кислородными вакансиями, равны 0.05 эВ. В то же время энергия активации первого участка на температурной зависимости сопротивления совпадает со значением донорного уровня в запрещенной зоне оксида цинка, полученным в работе [6]. Этот уровень соответствует существова-



**Рис. 3.** Изменение сопротивления сенсорной структуры наноразмерных стержней ZnO на воздействие молекул CO с концентрацией 50 ppm при температуре 523 К (*a*) и зависимость коэффициента газочувствительности *S* от концентрации CO ( $\delta$ ) при 473 (1), 523 (2) и 543 К (3).

#### нию одновалентных межузельных атомов цинка

 $(Zn_i^+)$ . Энергия активации второго участка соответствует донорному уровню, создаваемому в запрещенной зоне ZnO вакансией двухвалентного цинка  $(V_{Zn}^{2-})$  [23].

Известно, что наноразмерные проволоки и стержни следуют принципу "самоочищения", согласно которому точечные дефекты мигрируют во время роста из объема на поверхность в связи с малым расстоянием для диффузии [24]. Оставшаяся структура в основном лишена точечных дефектов. Следовательно, поверхность ZnO наностержней с большой вероятностью содержит участки, заряженные одно- или двукратно, которые могут являться адсорбционными центрами для молекул CO.

Для определения термодинамических параметров реакции взаимодействия молекул газа с поверхностью газочувствительного полупроводни-



**Рис. 4.** Зависимость изменения концентрации носителей заряда в массиве наноразмерных стержней оксида цинка от концентрации оксида углерода(II) при рабочих температурах 473 (1), 523 (2) и 543 К (3).

кового материала необходимо знать изменение концентрации носителей заряда, происходящее в процессе взаимодействия. Средняя концентрация носителей заряда в исходных наноразмерных стержнях оксида цинка оценивается на уровне  $2 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>, а подвижность — порядка 0.25 см<sup>2</sup>/В · с [19]. Известно, что в области невысоких температур (область примесной проводимости) температурная зависимость концентрации носителей заряда определяется уравнением Аррениуса [25]:

$$n = AT^{3/2} \exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right),\tag{1}$$

где A — предэкспоненциальный множитель,  $E_a$  — энергия активации при температурах в диапазоне 473—543 К, k — постоянная Больцмана. Предполагая, что изменение сопротивление материала связано в первую очередь с изменением концентрации электронов и используя экспериментально определенное значение энергии активации с помощью выражения (1), мы можем определить концентрацию электронов при заданной температуре.

Расчет изменения поверхностной концентрации носителей заряда ( $\Delta n$ ) в процессе взаимодействия газочувствительного материала с газом определяли по формуле, приведенной в работе [26]:

$$\Delta n = \frac{n_0}{L_0} \frac{R_g - R}{R},\tag{2}$$

где  $n_0$  — начальная концентрация носителей заряда без воздействия газа, см<sup>2</sup>; R — сопротивление при продувке воздухом, Ом;  $L_D$  — дебаевская длина, м, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$L_D = \left(\frac{\varepsilon \varepsilon_0 k T}{n_0 e^2}\right)^{1/2},\tag{3}$$

где  $\varepsilon$  — диэлектричекая проницаемость материала,  $\varepsilon_0$  — диэлектрическая постоянная,  $\Phi/м$ , e — заряд электрона, Кл.

На основании полученных данных были построены графики зависимости изменения концентрации носителей заряда  $\Delta n/n_0$  от концентрации оксида углерода(II) при рабочих температурах 473, 523 и 543 К (рис. 4). Полученные зависимости характеризуют вклад, который вносит в проводимость ZnO наностержней та часть адсорбированных на их поверхности молекул CO, которые приводят к генерации электронов в приповерхностном слое полупроводника. Найденные зависимости можно описать уравнением, аналогичным изотерме Ленгмюра [27, 28]:

$$\Delta n = n_0 \frac{bC}{1+bC} \,, \tag{4}$$

где *С* – концентрация, *b* – константа равновесия.

Из термодинамики известно, что константа равновесия *b* связана со стандартным изменением энергии Гиббса ( $\Delta G$ ) [28–30]:

$$\Delta G^0 = -RT \ln b, \tag{5}$$

где *R* – универсальная газовая постоянная.

Рассчитанная по уравнению (5) энергия Гиббса для массива ZnO наностержней в температурном диапазоне 470—540 К равномерно увеличивается от 37 до 46 кДж/моль. Зная энергию Гиббса, можно рассчитать изменение энтропии ( $\Delta$ S) по следующей формуле [28—30]:

$$-\Delta S = \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_{p,n}.$$
 (6)

Рассчитанные по уравнению (6) значения изменения энтропии для массива ZnO наностержней составляют ~125 Дж/К. Анализ результатов расчетов с помощью выражения для энергии Гиббса [28–30]

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \tag{7}$$

дает величину энтальпии процесса ∆Н, равную –(21.9–22.4) кДж/моль.

В работе [17] проводили теоретическую оценку энергии взаимодействия молекулы оксида углерода(II) с поверхностью газочувствительного оксидного материала, содержащего заряженные адсорбционные центры. Расчеты показали, что энергия взаимодействия равна 12.1 кДж/моль. Но так как молекула СО полярна (0.119 D) и обладает поляризуемостью ( $2 \cdot 10^{-24}$  см<sup>3</sup>) [31], то за счет ориентационной и индукционной составляющих энергия взаимодействия может увеличиться до 33.9 кДж/моль. Сравнивая полученную величину  $\Delta H$  с теоретически рассиятанной в работе [17]

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 39 № 2 2020

энергией взаимодействия молекулы оксида углерода(II) с заряженным адсорбционным центром поверхности газочувствительного оксидного материала, можно сделать вывод, что поверхность ZnO наноразмерных стержней действительно обладает заряженными адсорбционными центрами, с помощью которых и происходит взаимодействие.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основе экспериментально определенных значений энергии активации проводимости и коэффициента газочувствительности, проведен термодинамический анализ процесса взаимодействия оксида углерода (СО) с поверхностью массива ZnO наностержней. Величина энтальпии процесса  $\Delta H$  равна –(21.9–22.4) кДж/моль при температурах, лежащих в диапазоне 473–543 К. Показано, что такая энергия соответствует взаимодействию молекулы CO с заряженным адсорбционным центром поверхности оксида цинка.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Kołodziejczak-Radzimska A., Jesionowski T. // Materials. 2014. V. 7. P. 2833.
- Liu K.W., Ma J.G., Zhang J.Y., Lu Y.M. et al. // Solid-State Electron. 2007. V. 51. P. 757.
- 3. Wang Z.L, Song J. // Science. 2006. V. 312. P. 242.
- Xu H., Liu X., Cui D., Li M., Jiang M. // Sens. Actuators, B. 2006. V. 114. P. 301.
- 5. *Wang Z.L.* // J. Phys: Condens. Matter. 2004. № 16. R 829.
- Zhang D., Lee S.K., Chava S., Berven C.A., Katkanant V. // Physica B. 2011. V. 406. P. 3768.
- 7. *Кайдашев Е.М., Лянгузов Н.В., Лерер А.М., Распопова Е.А. //* Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40. Вып. 7. С. 79.
- Nikolaev A.L., Kamencev A.S., Lyanguzov N.V., Petrov V.V., Kaidashev E.M. // Proc. 2017 Intern. Conf. on "Physics, Mechanics of New Materials and Their Applications" / Eds: Parinov I.A., Chang S.-H. et al. New York: Nova Science Publ. Inc., 2018. P. 441.
- Cheng B., Yang S., Liu T., Vazinishayan A. // Sensors. 2018. V. 18. P. 1234.
- Cheng X.L., Zhao H., Huo L.H., Gao S., Zhao J.G. // Sens. Actuators, B. 2004. V. 102. P. 248.

- 11. *Bie, L.-J., Yan, X.-N., Yin, J., Duan, Y.-Q., Yuan, Z.-H.* // Ibid. 2007. V. 126. № 2. P. 604.
- Wang X., Zhang J., Zhu Z. // Appl. Surf. Sci. 2006. V. 252. P. 2404.
- Kumar R., Al-Dossary O., Kumar G., Umar A. // Nano-Micro Lett. 2015. V. 7. Issue 2. P. 97.
- 14. *Takata M., Tsubone D., Yanagida H. //* J. Amer. Ceram. Soc. 1976. V. 59. № 1–2. P. 4.
- Janotti A., Van de Walle C.G. // Appl. Phys. Lett. 2005. V. 87. P. 122102.
- Gurwitz R., Cohen R., Shalish I. // J. Appl. Phys. 2014. V. 115. P. 033701.
- 17. *Петров В.В.* // Нано- и микросистемная техника. 2007. № 1. С. 24.
- 18. Abdullin Kh.A., Bakranov N.B., Ismailov D.V. et al. // Semiconductors. 2014. V. 48. № 4. P. 471.
- Gritsenko L.V., Abdullin Kh.A., Gabdullin M.T. et al. // J. Cryst. Growth. 2017. V. 457. № 1. P. 164.
- 20. JCPDS карта № 00-001-1136; http://www.icdd.com/index.php/pdfsearch/
- Каменцев А.С., Четвериков С.Е., Петров В.В., Мясоедова Т.Н., Плуготаренко Н.К. // Матер. 25-й междунар. науч.-техн. конф. "Системы безопасности – 2016". М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. С. 99.
- Park W.J., Choi K.J., Kim M.H., Koo B.H., Lee J.-L., Baik J.M. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013. V. 5. P. 6802.
- 23. Xu C.X., Sun X.W., Zhang X.H., Ke L., Chua S.J. // Nanotechnology. 2004. V. 15. P. 856.
- 24. Dalpian G.M., Chelikowsky J.R. // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 96. 226802 (4p).
- 25. Шалимова К.В. Физика полупроводников. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Энергия, 1976.
- 26. Morrison S.R. // Sens. Actuators. 1982. V. 2. P. 329.
- 27. *Киселев В.Ф., Крылов О.В.* Адсорбционные процессы на поверхности полупроводников и диэлектриков. М.: Наука, 1978.
- 28. *Крылов О.В.* Гетерогенный катализ. М.: Академкнига, 2004.
- 29. *Воюцкий С.С.* Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1975.
- Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия / Под ред. Стромберга А.Г. М.: Высш. шк., 1973.
- Справочник химика / Под ред. Никольского Б.П. 2-е изд., перераб. и доп. В 3-х т. Т. 1. М., Л.: Химия, 1966.